•	sear c	II NO	.62	•
				Ш
				Ш
				Ш

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent un Reexamination	der
10/727,792	SRINIVASAN ET AL.	
Examiner	Art Unit	-
Benjamin P. Geib	2181	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
712	233	3/17/2006	BPG
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH N (INCLUDING SEARC)
	DATE	EXMR
East Search	3/17/2006	BPG
IEEE Xplore, Citeseer Search	3/17/2006	BPG
•		
	•	
	,	
•		
	•	